#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

# 第2674381号

(45)発行日 平成9年(1997)11月12日

(24)登録日 平成9年(1997)7月18日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18

H01S 3/18

請求項の数4(全 4 頁)

(21)出願番号	特願平3-235450	(73)特許権者 000004237
		日本電気株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)8月21日	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者 上野 芳康
(65)公開番号	特開平5-55698	東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気
(43)公開日	平成5年(1993)3月5日	株式会社内
	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者 藤井 宏明
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気
		株式会社内
		(72)発明者 五明 明子
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気
		株式会社内
		(74)代理人 弁理士 本庄 伸介
		<i>□</i>
		審査官後藤時男
		最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 半導体レーザ

## (57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 (0,0,1)面を持つ半導体基板と、 [-1,1,1]または[1,-1,1]方向に秩序状 態を持つ化合物半導体層を少なくとも含む活性層と、 [ - 1 , 1 , 0 ] 方向に形成されたレーザ共振器とを有 することを特徴とする半導体レーザ。

【請求項2】 (0,0,1)面から〔-1,1,0〕 方向または〔1,-1,0〕方向へ傾斜した面を持つ半 導体基板と、〔 - 1 , 1 , 1 〕または〔 1 , - 1 , 1 〕 方向に秩序状態を持つ化合物半導体層を少なくとも含む 10 【産業上の利用分野】本発明は、情報処理機器または光 活性層と、〔-1,1,0〕方向に形成されたレーザ共 振器とを有することを特徴とする半導体レーザ。

【請求項3】 前記半導体基板がGaAsでなり、該G a A s 基板上に形成した半導体多層構造の中に前記活性 層として(Alx Ga<sub>1-x</sub> )y In<sub>1-y</sub> P層またはIn

x Ga1-x As1-y Py 層が設けられていることを特徴 とする請求項1または2に記載の半導体レーザ。

【請求項4】 前記半導体基板がGaAsでなり、該I n P基板上に形成した半導体多層構造の中に前記活性層 としてIn<sub>1-x</sub> Ga<sub>x</sub> Asy P<sub>1-y</sub> 層が設けられている ことを特徴とする請求項1または2に記載の半導体レー ぜ。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

通信機器の光源に用いる半導体レーザに関する。

### [0002]

【従来の技術】半導体レーザは極めて小型でかつ量産性 に富むから、現在情報処理機器や光通信機器など様々な 光電気機器用の光源として幅広く利用されている。なか

3

でも視感度の高い発振波長を持つAlGaInP半導体レーザは、レーザビームポインタの小型化に活用されている。このような汎用装置に搭載する実用的な半導体レーザに要求される主な特性は、発振閾値電流が低いこと、摂氏 $40\sim60$  で安定な高温動作が可能なことなどである。近年、小林らは該AlGaInP半導体レーザが40mA程度の発振閾値電流を示すことを報告した(SPIE国際会議論文集、第898巻84頁、1988年)。また、勝山らは該半導体レーザが18mAの発振閾値電流を示すことをエレクトロニクスレターズ誌 10(第26巻1376頁、1990年)に報告した。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】レーザビームポインターに半導体レーザを搭載する場合、該半導体レーザを駆動する電池の容積が該ポインターの容積の殆どを占める。従って、該ポインターをさらに小型化するためには該半導体レーザの発振閾値電流を低減し、消費電力を低減することが必要である。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体レーザの 20 1 つは、(0,0,1)面を持つ半導体基板と、[-1,1,1]または[1,-1,1]方向に秩序状態を持つ化合物半導体層を少なくとも含む活性層と、[-1,1,0]方向に形成されたレーザ共振器とを有することを特徴とする。(0,0,1)面から[1,1,0]方向、[1,0]方向、[0,1,0]方向など任意の方向へ多少傾斜した面を持つ半導体基板を用いてもよい。

【0005】また、本発明のもう1つの半導体レーザは、(0,0,1)面から〔-1,1,0〕方向または 30〔1,-1,0〕方向へ傾斜した面を持つ半導体基板と、〔-1,1,1〕または〔1,-1,1〕方向に秩序状態を持つ化合物半導体層を少なくとも含む活性層と、〔-1,1,0〕方向に形成されたレーザ共振器とを有することを特徴とする。

## [0006]

【作用】五明らのグループ(フィジカルレビューレターズ誌第60巻2645頁、1988年)および他のグループはGaInP層、AlGaInP層、InGaAs層やInGaAs層やInGaAsP層などのエピタキシャル層が秩序状態を持つことを報告している。ただしこれらの半導体層が秩序状態を持つか否かはエピタキシャル成長条件に依存する。GaInPの場合、100以上のV族/III族供給原料比あるいは700以下の結晶成長温度で結晶成長すると該秩序状態が形成されることを五明らが報告している(アプライドフィジクスレターズ誌第50巻673頁、1987年)。秩序状態を持つGaolsのInの場合、Ga原子の副格子とIn原子の副格子が〔-1,1]あるいは〔1,-1,1]方向に交互に規則的に並ぶ。マスカレンハスらは、〔-1,1

1〕方向に該秩序状態を持つ半導体層の基底準位間発光 再結合が発生する光の電気ベクトルは(-1,1,1) 面内に偏ると報告した(フィジカルレビューレターズ誌 第63巻2108頁、1989年)。従って、〔-1, 1,1〕あるいは〔1,-1,1〕方向に秩序状態を持 つ半導体層で発生する再結合光の電気ベクトルは(-1,1,1)面あるいは(1,-1,1)面に偏る。 【0007】本発明の半導体レーザの1つでは、半導体 基板の面方位は(0,0,1)面である。レーザ共振器 は〔-1,1,0〕方向に形成する。このとき、該半導 体レーザのTEモード発振光の電気ベクトル方位は 〔1,1,0〕方向である。該電気ベクトル方位は上述 の (-1,1,1) 面および (1,-1,1) 面に含ま れる。従って、該半導体レーザでは、(-1,1,1) 面内あるいは(1,-1,1)面内方向に均一分布する 電気ベクトルを持つ再結合光のうち〔1,1,0〕方向 の電気ベクトルを持つ再結合光がレーザ発振に寄与す る。一方、従来の秩序状態を持たない半導体レーザで は、再結合光の電気ベクトルは3次元方向に均一分布 し、それらのうちで〔1,1,0〕方向の電気ベクトル を持つ再結合光だけがレーザ発振に寄与する。以上の作 用により、本発明の半導体レーザの再結合は従来より効 率的に発振モードに利得を与え、該半導体レーザはより 低い発振閾値電流を示す。なお、以上の作用から明らか なように、該半導体レーザではTMモードに比べてTE モードへの発光が助長されているので、TMモード発振 の抑制効果が高い、レーザ発振光へのTMモード自然放 出光の混入が少ないなどの特徴を持つ。

【0008】また、本発明の他の半導体レーザでは、 (0,0,1)から[-1,1,0]方向(または 〔1,-1,0〕方向)に傾斜した面を持つ半導体基板 を用いる。(0,0,1)面を持つ半導体基板上のエピ タキシャル層が持つ該秩序状態の方位は〔-1,1, 1〕方向と〔1,-1,1〕方向が同等に混在している のに対し、(0,0,1)から〔-1,1,0〕方向 (または〔1,-1,0〕方向)に傾斜した面を持つ半 導体基板上では該秩序状態の方位が〔-1,1,1〕方 向(〔1,-1,1〕方向)に偏ることが知られている (ジャパニーズジャーナルオブアプライドフィジクス誌 40 第28巻L1728頁1989年、および、1991年 春季応用物理学関係連合講演会講演32a-ZG-5)。つまり、該傾斜基板上の該エピタキシャル層が持 つ秩序状態の秩序度はより高い。従って、すでに述べた 本発明の作用はより強く働く。該傾斜基板を用いた場合 も再結合光の電気ベクトル方位はやはり( - 1 , 1 , 1)面(または(1,-1,1)面)に含まれる。レー ザ共振器方位は〔-1,1,0〕方向から〔0,0, 1〕方向へ傾くが、TEモード発振光の電気ベクトル方 位は依然〔1,1,0〕方向に保たれる。従って上述の 50 傾斜基板を用いた場合の再結合光電気ベクトル方位とT

5

E モード発振光電気ベクトル方位の間の幾何学的関係は、(0,0,1)基板の場合の関係と厳密に同等に保たれる。

## [0009]

【実施例】図1は本発明の半導体レーザの1つの実施例を示す。まず、Siドープのn型GaAsからなる半導体基板2の上に1.2μm厚のSiドープのn型(Al 0.7 Ga0.3 )0.5 In0.5 Pからなるクラッド層3、80nm厚のアンドープの(Alo.10 Ga0.90 )0.50 In0.50 Pからなる活性層4、1.2μm厚のZnドープ 10のp型(Alo.7 Ga0.3 )0.5 In0.5 Pからなるクラッド層5、をエピタキシャル成長した。活性層にInx Ga1.x As1.y Py 層を用いることも可能である。また、活性層にIn1x Gax Asy P1.y 層を用いてもよく、この場合は半導体基板2、クラッド層3およびクラッド層5にはInPを用いる。上述の活性層は単純な単一組成層からなるが、よく知られている多重量子井戸活性層を構成することもできる。この場合、再結合発光層となる量子井戸層に秩序状態を形成すればよい。

【0010】半導体基板2の面方位は、(0,0,1)から〔-1,1,0〕方向へ6度傾斜した面とした。該活性層に秩序度の高い秩序状態を形成するためには、10度以下の傾斜角が適当である。半導体基板2の面方位は(0,0,1)面でもよい。また、(0,0,1)面から〔1,1,0〕方向、〔1,0〕方向、〔0,1,0〕方向など任意の方向へ1~3度程度傾斜した面を持つ半導体基板2を用いてもよい。このような半導体基板は、よく知られているように、エピタキシャル結晶のモホロジーを改善する効果を持つ。

【0011】エピタキシャル成長は減圧有機金属結晶成 30 長法(MOVPE法)で行った。本実施例では結晶成長温度は660、V族/III族供給原料比は200とした。秩序度の高い秩序状態を形成するためには、結晶成長温度は700以下、V族/III族供給流量比は100以上が適当である。これらの結晶成長条件は、本発明の作用を持つ秩序状態を形成するための条件であるから、クラッド層など他の層の結晶成長条件は異なるものであっても構わない。成長速度はおよそ1.8 $\mu$ m/hrであった。原料にはトリメチルアルミニウム(TMA)、トリエチルガリウム(TEG)、トリメチルイン 40 デウム(TMI)、ジメチルジンク(DMZ)、フォスフィン(PH。)、アルシン(AsH。)、ジシラン(Si2H。)を用いた。ガスソース分子線結晶成長法

3

(GSMBE法)やケミカルビームエピタキシャル法 (CBE法)を用いて成長することも可能である。 【0012】エピタキシャル成長の後、フォトリソグラ フィー法を用いてクラッド層5にストライプ9を形成し た。ストライプ9の方位はほぼ〔-1,1,0〕方向で ある。該ストライプ9はレーザ共振器をなす。厳密に言 えば、傾斜基板を用いた場合、該レーザ共振器方向は [-1,1,0]方向から[0,0,1]方向などへ傾 く。該ストライプ9を形成した後、Siドープのn型G aAsからなるブロック層6を該ストライブ9の外側に 選択成長し、さらにZnドープのp型GaAsからなる コンタクト層7を全面に成長した。該コンタクト層7を 形成した後、n側の電極1とp側の電極8を形成した。 最後に劈開を行って相向かい合う反射鏡を(-1,1, 0)面に形成した。劈開の代わりにドライエッチングを 用いて該反射鏡を形成してもよい。また、垂直放射型半 導体レーザ(T. Takamoriet al.,アプ ライドフィジクスレターズ誌第55巻1053頁、19 89年)のように(-1,1,0)以外の面を持つ反射 20 鏡でもよく、曲面を持つ反射鏡でもよい。以上の工程に より、半導体レーザが完成した。該半導体レーザはTE モードで発振し、レーザ光10の電気ベクトル方位は [1,1,0]方向である。

## [0013]

【発明の効果】本発明の半導体レーザは、低い閾値と優れた高温動作特性を示した。なかでも、(0,0,1) 面から〔-1,1,0〕方向へ6度傾斜した半導体基板を用いた半導体レーザは、(0,0,1)半導体基板を用いた場合よりもさらに低い閾値電流を示した。

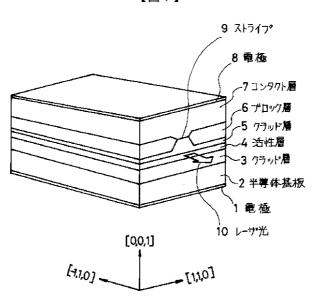
## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体レーザの1つの実施例を示した 斜視図である。

## 【符号の説明】

- 1 電極
- 2 半導体基板
- 3 クラッド層
- 4 活性層
- 5 クラッド層
- 6 ブロック層
- 7 コンタクト層
  - 8 電極
  - 9 ストライプ
  - 10 レーザ光

【図1】



# フロントページの続き

(56)参考文献 特開 平5-67839 (JP,A)

特開 平4-273490(JP,A)

特開 昭63 - 120492 (JP,A)

特開 平5-41560(JP,A)

特開 平5-29700(JP,A)

特開 平4-237183 (JP,A)